Котляр В.В., Панков И.А., Сойфер В.А.

МЕТОД РАСЧЕТА ФУНКЦИИ РЕЛЬЕФА ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ В ПРИБЛИЖЕНИИ РЭЛЕЯ.

Введение

Отражательные дифракционные решетки (ДР) используются во многих прикладных задачах оптики. В лазерной технике ДР используются для измерения мощности лазерных пучков как неискажающие структуру пучка ответвители излучения [1]. Их также используют как дифракционные поляризаторы для поворота вектора поляризации лазерных [2] или СВЧ [3] пучков. В задачах оптической обработки информации ДР используются в качестве многоканальных осветителей, которые мультиплицируют лазерный пучок на N пучков равной интенсивности [4]. К проблеме расчета светового поля, отраженного от дифракционной решетки (прямая задача дифракции) имеется несколько подходов разной степени сложности и точности: методы строгого решения электромагнитных уравнений Максвелла с соответствующими граничными условиями [5]; метод решения уравнений связанных волн [6]; метод Рэлея [7] и метод скалярной дифракции Кирхгофа [8].

В данной работе в рамках плосковолнового представления дифрагировавших волн (метод Рэлея) рассматривается обратная задача дифракции, в которой требуется найти функцию рельефа ДР по заданному распределению интенсивности света между дифракционными порядками. Приближение Рэлея дает наиболее точные результаты при условии, что максимальная высота h и период d рельефа решетки связаны с длиной волны света λ следующими неравенствами [9]: $d \leq 15\lambda, h \leq 1.5\lambda$.

1. Метод Рэлея.

В этом разделе, следуя [10], кратко рассмотрено получение амплитуды дифрагировавшего на решетке света в приближении Рэлея. На рис.1 показана оптическая схема описываемой ситуации. Плоская волна света с комплексной амплитудой $\psi_i(x,y)$ падает под углом Θ_0 на идеально отражающую ДР, профиль которой изменяется с периодом d вдоль оси x и не изменен вдоль оси z (эта ось направлена перпендикулярно рис.1):

$$\psi_i(x, y) = \exp\{ik(x\sin\Theta_0 - y\cos\Theta_0)\},\qquad(1)$$

где л=2π/λ-волновое число света.



Рис.1.Схема отражения плоской волны от поверхности решетки

Ограничимся рассмотрением случая ТЕполяризации, для которого электрический вектор плоской волны направлен вдоль оси z, а магнитный лежит в плоскости падения (x, y).

Полное световое поле $\psi(x,y)$ в полупространстве над решеткой (при у>max[$\xi(x)$], $\xi(x)$ -функция профиля решетки) удовлетворяет уравнению Гельмгольца:

$$\Delta \psi(x, y) + k^2 \psi(x, y) = 0 \tag{2}$$

с граничными условиями для идеально отражающей поверхности

$$\psi(x,y)\Big|_{y=\xi(x)} = 0.$$
(3)

Из (3) следует, что дифрагирующее на решетке световое поле удовлетворяет условию

$$\psi(x, y) = \psi_d(x, y) + \psi_i(x, y), \qquad (4)$$

$$\psi_{d}(x,y)\Big(_{y=\xi(x)} = \\ = -\exp\left\{ik\Big(x\sin\Theta_{0} - \xi(x)\cos\Theta_{0}\Big)\right\}.$$
(5)

Так как функция решетки периодическая: $\xi(x+d) = \xi(x)$, а функция, стоящая справа в уравнении (5) является квазипериодической, то следующая функция должна быть также периодической по x:

$$V(x, y) = \Psi_d(x, y) \exp\{-ikx\sin\Theta_0\}.$$
 (6)

Функцию (6) можно разложить в ряд Фурье:

$$V(x, y) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} V_n(y) \exp\left\{2\pi i \frac{nx}{d}\right\}.$$
 (7)

Из уравнений (6) и (7) следует плосковолновое представление для амплитуды дифрагировавшего поля:

$$\psi_d(x, y) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} V_n(y) \exp\{ik\alpha_n x\}$$
(8)

где $\alpha_n = \sin \Theta_0 + n \frac{\lambda}{d}$.

Подставив уравнение (8) в уравнение Гельм-гольца, получим выражение:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\frac{d^2 V_n(y)}{dy^2} + k^2 \beta_n^2 V_n(y) \right] \exp\left\{ 2\pi i \frac{nx}{d} \right\} = 0, (9)$$

из которого следуют уравнения для функций V_n(у):

$$\frac{d^2 V_n(y)}{dy^2} + k^2 \beta_n^2 V_n(y) = 0, \qquad (10)$$

где $\beta_n^2 = 1 - \alpha_n^2$.

Решение уравнения (10) имеет вид:

$$V_n(y) = B_n \exp\{ik\beta_n y\}.$$
 (11)

Уравнение (8) с учетом (11) приводит к следующему виду разложения дифрагировавшего поля по плоским волнам при $y > max [\xi(x)]$:

$$\psi_d(x,y) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} B_n \psi_n(x,y), \qquad (12)$$

$$\psi_n(x, y) = \exp\{ik(\alpha_n x + \beta_n y)\}.$$
 (13)

Заметим, что сумма (12) содержит как однородные плоские волны (при $\alpha_n^2 < 1$), так и неоднородные волны, экспоненциально затухающие вдоль оси у при условии $\alpha_n^2 > 1$.

Гипотеза Рэлея состоит в том, что разложение поля (12) верно не только при $y > max [\xi(x)]$, но и при у $\geq \xi(x)$. При этом из уравнений (5) и (12) получим выражение для поиска коэффициентов B_n :

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} B_n \psi_n \left(x, \xi(x) \right) = -\psi_i \left(x, \xi(x) \right).$$
(14)

При ограничении числа дифрагировавших порядков -N < n < N и при выборе последовательности точек x_m уравнение (14) приводит к линейной системе алгебраических уравнений относительно неизвестных B_n :

$$\sum_{n=-N}^{N} B_n \psi_{nm} = -\psi_{im} , \qquad (15)$$

где $\psi_{nm} = \psi_n(x_m, \xi(x_m)), \ \psi_{im} = \psi_i(x_m, \xi(x_m)).$

2. Алгоритм расчета рельефа решетки.

В этом разделе рассматривается обратная задача и приводится итеративный алгоритм расчета функции ξ(x) по заданным модулям коэффициентов В_n. Квадраты модулей коэффициентов |В_n| = I_{n0} представляют собой интенсивности дифрагировавших порядков, которые требуется сформировать. Эту задачу предлагается решать следующим образом. Из уравнения (14) видно, что функция $\psi_d(x,y)$ должна быть только фазовой при $y = \xi(x)$: $|\psi_d(x, y)| = \xi(x)$ $\xi(x)) = |\psi_i(x, \xi(x))| = 1$. Пользуясь неопределенностью аргументов комплексных коэффициентов В_n суммы (12), можно итеративным способом рассчитать дифрагировавшее поле, которое бы имело единичный модуль в прямоугольной области: - d/2<x<d/2, - $\lambda/2 < y < \lambda/2$. Алгоритм расчета сходен с известным алгоритмом Герчберга-Секстона [11] и имеет следующие шаги.

1. Пусть на р-ом шаге итераций оценка функции дифрагировавшего поля имеет вид

$$\psi_{d}^{(p)}(x,y) = \exp\{iQ_{p}(x,y)\}.$$
 (16)

2. Функция (16) разлагается в ряд по ортогональным функциям (13), коэффициенты которого находятся по формулам:

$$B_{n}^{(p)} = \frac{1}{\lambda d} \int_{0}^{d} \int_{-\frac{\lambda}{2}}^{\frac{\lambda}{2}} \exp\left\{iQ_{p}\left(x,y\right) - \frac{1}{\lambda d}\left(\alpha_{n}x + \beta_{n}y\right)\right\} dxdy$$

$$(17)$$

3. Рассчитанные коэффициенты B_n видоизменяются с учетом заданных значений интенсивности порядков:

$$\overline{B}_{n}^{(p)} = \sqrt{I_{n0}} \exp\left\{i \arg\left(B_{n}^{(p)}\right)\right\}.$$
(18)

4. Следующая оценка фазы функции дифрагировавшего поля находится по формуле

$$Q_{p+1}(x,y) = \arg\left\{\sum_{n=-\infty}^{\infty} \overline{B}_{n}^{(p)} \exp\left[ik\left(\alpha_{n}x + \beta_{n}y\right)\right]\right\}$$
(19)

5. Далее следует переход к первому пункту и т. д.

Можно показать, что этот алгоритм будет сходиться в среднем, то есть для любого номера р выполняется неравенство

$$\int_{0}^{d} \int_{-\frac{\lambda}{2}}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p+1)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \le \right) \right] \\ \leq \int_{0}^{d} \int_{-\frac{\lambda}{2}}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right) \right] \\ \leq \int_{0}^{d} \int_{-\frac{\lambda}{2}}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right) \right] \\ \leq \int_{0}^{d} \int_{-\frac{\lambda}{2}}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right) \right] \\ \leq \int_{0}^{d} \int_{-\frac{\lambda}{2}}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right) \right] \\ \leq \int_{0}^{d} \int_{-\frac{\lambda}{2}}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right) \right] \\ \leq \int_{0}^{d} \int_{-\frac{\lambda}{2}}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right) \right] \\ \leq \int_{0}^{d} \int_{-\frac{\lambda}{2}}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right) \right] \\ \leq \int_{0}^{d} \int_{-\frac{\lambda}{2}}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right) \right] \\ \leq \int_{0}^{d} \int_{-\frac{\lambda}{2}}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right) \right] \\ \leq \int_{0}^{d} \int_{0}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right) \right] \\ \leq \int_{0}^{d} \int_{0}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right) \right] \\ \leq \int_{0}^{d} \int_{0}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right) \right] \\ \leq \int_{0}^{d} \int_{0}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right) \right] \\ \leq \int_{0}^{d} \int_{0}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right) \right] \\ \leq \int_{0}^{d} \int_{0}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right) \right] \\ \leq \int_{0}^{d} \int_{0}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right) \right] \\ \leq \int_{0}^{d} \int_{0}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right) \right] \\ \leq \int_{0}^{d} \int_{0}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right) \right] \\ \leq \int_{0}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right] \\ \leq \int_{0}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right] \\ \leq \int_{0}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right] \\ \leq \int_{0}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right] \\ \leq \int_{0}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right] \\ \leq \int_{0}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right] \\ \leq \int_{0}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}(x,y) \left(-1 \right)^{2} dx dy \right] \\ \leq \int_{0}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_{d}^{(p)}$$

Пусть при достаточном числе шагов среднее квадратичное отклонение δ достигло заданного значения δ_0 :



Рис. 2. Графическое решение уравнения(22)

$$\delta_p = \frac{1}{\lambda d} \sqrt{\int_0^d \int_{\frac{\lambda}{2}}^{\frac{\lambda}{2}} \left[\left(\psi_d^{(p)}(x, y) \left(-1 \right)^2 dx dy \le \delta_0, (21) \right) \right]^2}$$

тогда, исходя из уравнения (14) можно записать уравнение для поиска функции рельефа ξ(x):

$$Q_{p}\left(x,\xi\left(x\right)\right) = \pi + k\alpha_{0}x - k\beta_{0}\xi\left(x\right)$$
(22)

где $Q_p(x, \xi(x))$ - рассчитанная на р-ой итерации фаза дифрагировавшего поля $\psi_d(x,y)$. На рис.2 показано, что решение уравнения (22) при $\Theta_0 = 0$ ($\alpha_0 = 0$, $\beta_0 = 1$) и для любой точки x_0 находится из пересечения прямой $f_1(y)$ =-2 π/λ и кривой $f_2(y) = Q_p(x_0, y) - \pi$.

3.Численные результаты.

На рис.3-6 приведены рассчитанные описанным выше методом рельефы одного периода дифракционных решеток $h = \xi(x)$ рассеивающих падающую плоскую волну в заданных направлениях а) и угловое распределение нормированной интенсивности рассеянного на этих решетках поля полученное в результате расчета с помощью интеграла Кирхгофа б). Расчеты были проведены для нормально падающей плоской волны (длина волны λ) период рассчитываемой решетки T = 20 λ . При расчете задавались несколько порядков одинаковой интенсивности: 0, 1 (рис.3б); -1, 1 (рис.4б); 0, 1 (рис.5б) и 0, 1, 2 (рис.6б).



Рис.3. Функция периода двухпорядковой (несимметричной) решетки а) и угловое распределение нормированной интенсивности рассеянного света б)



Рис.4. Функция периода двухпорядковой (симметричной) решетки а) и угловое распределение нормированной интенсивности рассеянного света б)



Рис.5. Функция периода трехпорядковой (симметричной) решетки а) и угловое распределение нормированной интенсивности рассеянного света б).



Рис.6. Функция периода пятипорядковой (симметричной) решетки а) и угловое распределение нормированной интенсивности рассеянного света б).

Из рисунков видно что предложенный метод позволяет рассчитывать решетки, создающие заданное количество распространяющихся в заданных направлениях дифракционных порядков, но распределение энергии между ними не всегда точно соответствует заданному.

Литература.

1 Апполонов В.В., Бочкарев Е.Л., Заславский В.Я. и др. Ответвитель лазерного пучка на дифракционной решетке. //pp Квантовая электроника, 1979, т. 6, N 3, с. 615-618

2 Haidner H., Kipher P., Sheridan J.T. et al. Polarizing reflection grating beamsplitter for 10.6 μ m wavelength. // Opt. Eng., 1993, v. 32, N 8, p. 1860-1865

3 Sweeney D.W., Gallagher N.C. Multi-element microwave computer generated holograms. // Proc. SPIE, 1988, v. 884, p. 114-119

4 Vassara A., Taghizadeh M.R., Turunen J. et al. Binary surfase-relief gratings for array illumination in digital optics. // Appl. Opt., 1992, v. 31, N 7, p. 3320-3336 5 Electromagnetic theory of graitings: Topics in current physics, v. 22, Ed. by R. Petit, N.Y.: Springer-Verlag, 1980

6 Moharam M.G., Gaylord T.K. Rigorous coupled-wave analysis of metallic surfase-relief gratings. // J. Opt. Soc. Am. A, 1986, v. 3, N 11, p. 1780-1787

7 Hugonin J.P., Petit R., Cadilhac M. Plane wave expansions used to describe the field diffracted by a grating. // J. Opt. Soc. Am. A, 1981, v. 71, N 5, p. 593-597

8 Бреховских Л.М. Дифракция волн на шероховатой поверхности. // ЖЭТФ, 1952, т. 23, N 3, с. 275-304

9 Vanden Berg P.M., Fokkema J.T. The Rayleigh hypothesis in the theory of reflection by a grating. // J. Opt. Soc. Am., 1979, v. 69, N 1, p. 27-31

10 Смокий О.И., Фабриков В.А. Методы теории систем и преобразований в оптике, Ленинград, Наука, 1989

11 Gerchberg R.W., Saxton W.O. A practical algorithm for the determination of the phase from image and diffraction plane pictures. // Optik, 1972, v. 35, N 2, p. 237-246.